Biometryczne wspomaganie interakcji człowiek-komputer Biometria twarzy

Bartłomiej Stasiak

bartlomiej.stasiak@p.lodz.pl basta@ics.p.lodz.pl

> Instytut Informatyki Politechnika Łódzka

> > 2017

Plan wykładu

- Biometria twarzy
 - Wstęp
 - Eigenfaces
 - Inne metody
 - Bazy zdjęć twarzy
 - Rozpoznawanie twarzy modele 3D
 - Rozpoznawanie twarzy analiza wielospektralna

Rozpoznawanie twarzy – wstęp

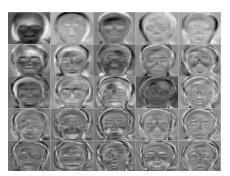
- Rozpoznawanie twarzy to jeden z najbardziej podstawowych sposobów identyfikacji osób wykorzystywany przez człowieka
- W systemach automatycznej identyfikacji i kontroli dostępu istotne są następujące elementy:
 - Wysoka akceptowalność i uniwersalność
 - Łatwość akwizycji, również bez wiedzy użytkownika
 - Duża zmienność wewnątrzklasowa (różne warunki akwizycji, oświetlenie, pozycja względem kamery, niejednorodne tło, zmienny wyraz twarzy, fryzura, zarost, okulary, i in.)
 - Umiarkowana unikalność i trwałość (zmiany spowodowane starzeniem, urazy, blizny)



Rozpoznawanie twarzy – wstęp

- Metody rozpoznawania twarzy można zasadniczo podzielić na:
 - Metody oparte na ekstrakcji cech punktów charakterystycznych (oczy, brwi, nos, usta, podbródek), ich lokalizacji, kształtu i relacji przestrzennych (kąty, odległości)
 - Metody globalne, opisujące wygląd twarzy traktowanej jako obraz złożony z pewnej ilości obrazów składowych
 - Eigenfaces (PCA, ang. Principal Component Analysis)
 - Fisherfaces (LDA, ang. Linear Discriminant Analysis)
 - Tensorfaces (HOSVD, ang. *Higher-Order Singular Value Decomposition*)
 - Corefaces (shift-invariant PCA-correlation filter)
 - Metody oparte na odwzorowaniach LPP (ang. Locality Preserving Projections w przestrzeniach topologicznych
 - Metoda EBGM (ang. Elastic Bunch Graph Matching)
 - Modelowanie 3D
 - ...

- Klasyczna metoda rozpoznawania twarzy oparta na dekompozycji twarzy za pomocą "twarzy wzorcowych/prototypowych"
 - M. Turk and A. Pentland (1991). "Eigenfaces for recognition". Journal of Cognitive Neuroscience 3 (1): 71–86.





- Niech ${\it x}$ będzie wektorem w ${\it N}$ -wymiarowej przestrzeni unitarnej, a zbiór $\{\varphi_{\it i}: i=0,1,...,N-1\}$ niech będzie pewną bazą tej przestrzeni
- Wektor **x** możemy zatem przedstawić jako:

$$\boldsymbol{x} = \sum_{n=0}^{N-1} \varphi_n y(n) = F \boldsymbol{y}$$
 (1)

gdzie kolumny macierzy F stanowią wektory bazowe:

$$F = [\varphi_0 \varphi_1 ... \varphi_{N-1}]$$

zaś składowe wektora ${\it y}$ interpretujemy jako współrzędne wektora ${\it x}$ względem bazy $\{\varphi_i\}$

• Aby obliczyć składowe y(n) dla danego x mnożymy (iloczyn skalarny) obie strony równania (1) kolejno przez wszystkie wektory bazowe φ_i , dla j=0,1,...,N-1

$$\langle \mathbf{x}, \varphi_{\mathbf{j}} \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} \langle \varphi_{\mathbf{n}}, \varphi_{\mathbf{j}} \rangle y(n)$$

• Otrzymujemy w ten sposób układ N równań liniowych z niewiadomymi y(n):

$$Ay = a$$

gdzie:

$$A = \begin{bmatrix} <\varphi_0, \varphi_0 > & \cdots & <\varphi_{N-1}, \varphi_0 > \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ <\varphi_0, \varphi_{N-1} > & \cdots & <\varphi_{N-1}, \varphi_{N-1} > \end{bmatrix}, \ a = \begin{bmatrix} <\mathbf{x}, \varphi_0 > \\ \vdots \\ <\mathbf{x}, \varphi_{N-1} > \end{bmatrix}$$

• Z liniowej niezależności wektorów φ_i mamy, że $\det(A) \neq 0$, a zatem:

$$\mathbf{y} = A^{-1}\mathbf{a}$$

ullet Zakładając dodatkowo, że baza $\{arphi_i\}$ jest ortogonalna, tj. że

$$=egin{cases} 0 & ext{, if } k
eq m \ ||arphi_{m{k}}||^2 & ext{, if } k=m \end{cases}$$

otrzymujemy diagonalną macierz A:

$$A = diag(||\varphi_0||^2, ||\varphi_1||^2, ..., ||\varphi_{N-1}||^2)$$

• Jeśli przyjmiemy bazę $\{\varphi_i\}$ ortonormalną, wówczas macierz A będzie macierzą jednostkową i oczywiście $A=A^{-1}$

• Reasumując, dla ortonormalnej bazy $\{\varphi_i\}$ wektor ${\it y}$ obliczymy jako:

$$\mathbf{y} = A^{-1}\mathbf{a} = \mathbf{a} = \begin{bmatrix} \langle \mathbf{x}, \varphi_0 \rangle \\ \vdots \\ \langle \mathbf{x}, \varphi_{N-1} \rangle \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \varphi_0' \\ \vdots \\ \varphi_{N-1}^T \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

czyli
$$\mathbf{y} = F^T \mathbf{x}$$

• Zauważmy, że w tym przypadku F jest macierzą ortogonalną $F^T = F^{-1}$ oraz, że współrzędne y(n) w reprezentacji:

$$\mathbf{x} = \sum_{n=0}^{N-1} \varphi_n \mathbf{y}(n)$$

obliczamy po prostu jako iloczyny skalarne wektora \mathbf{x} z odpowiednimi wektorami bazowymi: $y(n) = \langle \mathbf{x}, \varphi_n \rangle$

- Baza ortonormalna $\{\varphi_i\}$ może być ustalona z góry
 - Przekształcenie Fouriera (ang. Discrete Fourier Transform, DFT)
 - Przekształcenie Hartley'a (ang. Discrete Hartley Transform, DHT)
 - Przekształcenie cosinusowe (ang. Discrete Cosine Transform, DCT)
 - ...
- Można również wyznaczyć wektory bazowe dla danego zbioru wektorów wejściowych (każdy zbiór danych wejściowych będzie miał wtedy "swoją" bazę $\{\varphi_i\}$)
 - W metodzie PCA wykorzystujemy w tym celu wektory własne macierzy kowariancji zbioru wejściowego

- Załóżmy, że zbiór wejściowy dany jest w postaci macierzy $X_{N\times M}$, w której każda kolumna x_m reprezentuje cechy jednego spośród M obiektów
 - Jeśli obiektami wejściowymi są obrazy, możemy przyjąć, że odpowiadające im wektory x_m powstają poprzez konkatenację wierszy lub kolumn
- Zakładamy, że dane wejściowe zostały wstępnie "wycentrowane", tj. od każdej kolumny odjęto wektor średnich:

$$\forall m = 0, 1, ..., M - 1 : \mathbf{x_m} := \mathbf{x_m} - \boldsymbol{\mu}$$

gdzie elementy wektora μ obliczamy jako:

$$\mu(n) = \frac{1}{M} \sum_{m=0}^{M-1} \mathbf{x_m}(n)$$

• Dla danych wejściowych x obliczamy macierz kowariancji $\Sigma_x = [\Sigma_{ii}] = E[(x - E[x])(x - E[x])^T]$, gdzie:

$$\Sigma_{ij} = \text{cov}(x(i), x(j)) = E[(x(i) - E[x(i)])(x(j) - E[x(j)])]$$

dla i, j = 0, 1, ..., N - 1, lub równoważnie:

$$\Sigma_{ij} = E[(x(i))(x(j))] - E[x(i)]E[x(j)]$$

lub prościej – uwzględniając, że odjęliśmy średnie:

$$\Sigma_{ij} = E[(x(i))(x(j))]$$

 W praktyce, macierz kowariancji może być estymowana na podstawie danych wejściowych (po odjęciu średnich):

$$\Sigma_{x} = E[\mathbf{x}\mathbf{x}^{T}] \approx \frac{1}{M}XX^{T} = \frac{1}{M}\sum_{m=0}^{M-1} \mathbf{x}_{m}\mathbf{x}_{m}^{T}$$

- Zauważmy, że Σ_x jest macierzą symetryczną $(\Sigma_x^T = \Sigma_x)$, a zatem jej wektory własne są wzajemnie ortogonalne
 - Istotnie, dla dowolnych wektorów własnych φ_i , φ_j i związanych z nimi wartości własnych $\lambda_i \neq \lambda_i$, mamy:

$$\Sigma_{\mathsf{x}}\varphi_{\mathsf{i}} = \lambda_{\mathsf{i}}\varphi_{\mathsf{i}} \tag{2}$$

$$\Sigma_{\mathsf{x}}\varphi_{\mathbf{j}} = \lambda_{\mathsf{j}}\varphi_{\mathbf{j}} \tag{3}$$

Mnożąc (2) lewostronnie przez φ_{j}^{T} , a transpozycję (3) prawostronnie przez φ_{i} i odejmując stronami otrzymujemy:

$$0 = (\lambda_i - \lambda_j) \varphi_j^T \varphi_i$$

a zatem wektory φ_i , φ_j są ortogonalne (dla $\lambda_i = \lambda_j$ można je również łatwo zortogonalizować)

• Zauważmy także, że Σ_x jest macierzą nieujemnie określoną, tj.

$$v^T \Sigma_x v \geq 0$$

dla dowolnego niezerowego wektora $oldsymbol{v}$

• A zatem, dla dowolnego wektora własnego φ_i o znormalizowanej długości $(\varphi_i^T \varphi_i = 1)$ mamy:

$$\Sigma_{\mathsf{x}}\varphi_{\mathsf{i}}=\lambda_{\mathsf{i}}\varphi_{\mathsf{i}}$$

skąd:

$$0 \leq \varphi_{\mathbf{i}}^{\mathsf{T}} \Sigma_{\mathsf{x}} \varphi_{\mathbf{i}} = \lambda_{i}$$

- Ponadto, jeśli Σ_x jest odwracalna, wówczas $\lambda_i \neq 0$ (wyznacznik macierzy kwadratowej jest równy iloczynowi jej wartości własnych)
- W takim wypadku mamy więc, że:

Wartości własne macierzy korelacji są dodatnie

• Rozważmy teraz macierz przekształcenia F złożoną z (kolumnowych) wektorów własnych $\varphi_0, \varphi_1, ..., \varphi_{N-1}$ macierzy kowariancji Σ_x :

$$\mathbf{y} = \mathbf{F}^T \mathbf{x}$$

• Po odjęciu średnich mamy $E[x] = 0 \implies E[y] = 0$, a więc macierz kowariancji Σ_y obliczymy jako:

$$\Sigma_{y} = E[\mathbf{y}\mathbf{y}^{T}] = E[F^{T}\mathbf{x}\mathbf{x}^{T}F] = F^{T}\Sigma_{x}F$$

• Z definicji macierzy F wynika zatem natychmiast, że Σ_y jest macierzą diagonalną:

$$\Sigma_{y} = \operatorname{diag}(\lambda_{0}, \lambda_{1}, ..., \lambda_{N-1})$$

- Podobnie, macierz korelacji dla Y będzie również diagonalna
- A zatem przekształcenie F prowadzi do dekorelacji danych wejściowych

 Zastępując macierz przekształcenia F macierzą złożoną z K wektorów bazowych (K < N):

$$\hat{F}_{N\times K} = [\varphi_0, \varphi_1, ..., \varphi_{K-1}]$$

otrzymujemy pewną aproksymację wektora x:

$$\hat{\mathbf{x}} = \sum_{i=0}^{K-1} y(i) \varphi_i$$

stanowiącą jego rzut na podprzestrzeń wyznaczoną przez pierwsze K wektorów własnych macierzy kowariancji Σ_x

 Istotną kwestią jest taki wybór wektorów własnych, który zminimalizuje oczekiwany błąd aproksymacji (MSE, Mean Square Error):

$$E\left[||\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}||^2\right] = E\left[\left\|\sum_{i=K}^{N-1} y(i)\varphi_i\right\|^2\right]$$

Pamietajac, że:

$$\|\boldsymbol{v}\|^2 = \boldsymbol{v}^T \boldsymbol{v}$$

oraz korzystając z ortogonalności wektorów φ_i łatwo pokazać, że:

$$E\left[||\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}||^2\right] = \sum_{i=K}^{N-1} E[y^2(i)]$$

• Ponadto uwzględniając, że $\mathbf{y} = F^T \mathbf{x}$, mamy:

$$E[||\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}||^2] = \sum_{i=K}^{N-1} E[(\varphi_i^T \mathbf{x})(\varphi_i^T \mathbf{x})] =$$

$$= \sum_{i=K}^{N-1} E[(\varphi_i^T \mathbf{x})(\mathbf{x}^T \varphi_i)] = \sum_{i=K}^{N-1} (\varphi_i^T E[\mathbf{x} \mathbf{x}^T] \varphi_i)$$

• Ponieważ po odjęciu średnich od wektora x mamy:

$$E[\mathbf{x}\mathbf{x}^T] = \Sigma_{\mathbf{x}}$$

możemy więc skorzystać z definicji wektora własnego, otrzymując ostatecznie:

$$E\left[||\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}||^2\right] = \sum_{i=K}^{N-1} (\varphi_i^T \lambda_i \varphi_i) = \sum_{i=K}^{N-1} \lambda_i$$

 A zatem wybierając K wektorów własnych macierzy kowariancji związanych z K największymi wartościami własnymi uzyskujemy minimalizację błędu aproksymacji, który jest wówczas równy sumie N – K najmniejszych wartości własnych

- Bezpośrednie wykorzystanie macierzy kowariancji obrazów wejściowych jest zwykle zbyt złożone obliczeniowo
 - Przykładowo, obraz 100×100 pikseli reprezentujemy jako wektor $100 \cdot 100 = 10,000$ -elementowy
 - Macierz kowariancji Σ_x będzie mieć zatem wymiary $10,000 \times 10,000$ (100,000,000 elementów!)
 - Jednak rząd macierzy Σ_x jest ograniczony liczbą obrazów (dla N obrazów tylko N-1 wektorów własnych będzie mieć niezerowe wartości własne)
- Jeśli liczba obrazów (treningowych) jest mniejsza w stosunku do ich wymiarów (ilości pikseli) można zastosować mniej złożoną obliczeniowo metodę obliczania PCA

- Po odjęciu średnich od macierzy wektorów wejściowych obliczamy: $\Sigma_x \approx XX^T$
- Z definicji wektorów własnych:

$$\lambda_i \varphi_i = \Sigma_{\mathsf{X}} \varphi_i = \mathsf{X} \mathsf{X}^\mathsf{T} \varphi_i$$

 Jednak macierz XX^T ma duże wymiary – obliczamy więc wektory własne dla macierzy X^TX:

$$X^T X \psi_i = \lambda_i \psi_i$$

Mnożąc obie strony przez X mamy:

$$XX^TX\psi_i = \lambda_i X\psi_i$$

co oznacza, że jeśli ψ_i jest wektorem własnym macierzy X^TX , to $\varphi_i = X\psi_i$ jest wektorem własnym macierzy Σ_x

- Analiza składowych głównych (PCA) pozwala na reprezentację danych optymalną w sensie współczynnika kompresji, ale nie uwzględnia podziału na klasy
- Wykorzystanie informacji o klasach zapewnia liniowa analiza dyskryminacyjna (ang. linear discriminant analysis/Fisher's linear discriminant, LDA/FLD)
 - Rozważmy dwie klasy obiektów, reprezentowanych przez wektory cech x i załóżmy, że ich wektory średnich dane są jako μ_0 i μ_1 , a macierze kowariancji jako Σ_0 i Σ_1 , odpowiednio
 - Poszukujemy takiej kombinacji liniowej cech wx, która zmaksymalizuje separację pomiędzy klasami

- Zauważmy, że wartości średnie kombinacji liniowej wx będą równe $w\mu_0$ i $w\mu_1$ dla obu klas, odpowiednio
- Podobnie, wariancje w obu klasach obliczymy jako: $\mathbf{w}^T \Sigma_0 \mathbf{w}$ i $\mathbf{w}^T \Sigma_1 \mathbf{w}$, odpowiednio
- Zatem separację (FLD) pomiędzy rozkładami cech w obu klasach definiujemy jako:

$$S = \frac{\sigma_{mk}^2}{\sigma_{wk}^2} = \frac{(\mathbf{w}^T \mu_1 - \mathbf{w}^T \mu_0)^2}{\mathbf{w}^T \Sigma_1 \mathbf{w} + \mathbf{w}^T \Sigma_0 \mathbf{w}} = \frac{(\mathbf{w}^T (\mu_1 - \mu_0))^2}{\mathbf{w}^T (\Sigma_0 + \Sigma_1) \mathbf{w}}$$

 Maksymalną separację pomiędzy klasami uzyskujemy dla wektora w danego jako:

$$(\Sigma_0 + \Sigma_1)^{-1} \mu_1 - \mu_0$$

• W ogólnym przypadku *c* klas definiujemy macierz rozproszenia międzyklasowego (ang. *between-class scatter matrix*):

$$S_B = \sum_{i=0}^{c-1} N_i (\mu_i - \mu) (\mu_i - \mu)^T$$

... oraz macierz rozproszenia wewnątrzklasowego (ang. within-class scatter matrix):

$$S_W = \sum_{i=0}^{c-1} \sum_{\mathbf{x}_k \in X_i} (\mathbf{x}_k - \mu_i) (\mathbf{x}_k - \mu_i)^T$$

gdzie c jest liczbą klas, a N_i jest liczbą elementów w klasie X_i .

 Optymalne wektory bazowe otrzymujemy poprzez maksymalizację wyrażenia:

$$W_{ ext{opt}} = \underset{W}{\operatorname{argmax}} \frac{|W^T S_B W|}{|W^T S_W W|} = [\boldsymbol{w}_0, ..., \boldsymbol{w}_K]$$

gdzie $\{\mathbf{w}_i\}$ to zbiór uogólnionych wektorów własnych, odpowiadający uogólnionym wartościom własnym $\{\lambda_i\}$:

$$S_B \mathbf{w}_i = \lambda_i S_W \mathbf{w}_i$$

 Z uwagi na wysoki wymiar przestrzeni wejściowej (w stosunku do ilości twarzy) w metodzie Fisherfaces dokonuje się najpierw redukcji wymiaru za pomocą PCA:

$$W_{FLD} = \underset{W}{\operatorname{argmax}} \frac{|W^T W_{\text{PCA}}^T S_B W_{\text{PCA}} W|}{|W^T W_{\text{PCA}}^T S_W W_{\text{PCA}} W|}$$

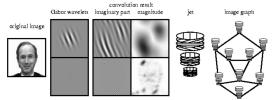
Rozpoznawanie twarzy

 Metoda EBGM (ang. Elastic Bunch Graph Matching) opiera się na modelowaniu twarzy za pomocą grafu łączącego punkty charakterystyczne (kąciki oczu, nos, podbródek)





 Do generowania cech wykorzystuje się rodzinę falek Gabora o różnej częstotliwości i orientacji



Rozpoznawanie twarzy

• Metoda AAM (ang. Active Appearance Models)





- Tensorfaces
 - Zbiór technik rozpoznawania twarzy w oparciu o metody algebry wieloliniowej
 - Zbiór treningowy zróżnicowany pod względem tożsamości użytkowników, a także warunków oświetleniowych, póz, etc. modeluje się za pomocą tensorów/macierzy o wymiarach $N_{pixel} \times (N_{user} \times N_{light} \times N_{pose})$
 - Przekształcenie HOSVD, (ang. Higher-Order Singular Value Decomposition) pozwala na dekompozycję k-wymiarowych tensorów na sumę ważoną (zewnętrznych) iloczynów k niezależnych wektorów

Rozpoznawanie twarzy – bazy testowe

- Face Recognition Grand Challenge (FRGC)
 - Konkurs organizowany przez NIST
 - Zbiór treningowy
 - Generic training set 12,776 zdjęć (222 osób) wykonanych w kontrolowanych i niekontrolowanych warunkach oświetleniowych
 - Zbiór testowy
 - Target set (gallery set) 16,028 zdjęć (466 osób) wykonanych w kontrolowanych warunkach oświetleniowych
 - Probe set 8,014 zdjęć (466 osób) wykonanych w niekontrolowanych warunkach oświetleniowych





Rozpoznawanie twarzy – bazy testowe

- Pose Illumination Expression (PIE)
 - Baza zdjęć opracowana przez CMU
 - 41,368 zdjęć twarzy (68 osób)
 - 13 różnych póz, 43 różnych warunków oświetleniowych,
 - 4 typy wyrazów twarzy (neutralny, uśmiech, mruganie, rozmowa)



Rozpoznawanie twarzy – bazy testowe

- Baza YALE
 - 165 obrazów (gif) w odcieniach szarości
 - 15 osób
 - 11 zdjęć jednej osoby
 - światło z przodu/z lewej/z prawej
 - z okularami i bez
 - wyraz twarzy neutralny/smutny/wesoły/śpiący/zdziwiony/mruganie



- Motywacja: większa niezależność od warunków oświetleniowych, w stosunku do metod "fotometrycznych" (2D)
- Akwizycja:
 - Wykorzystanie oświetlenia strukturalnego (active structured lighting)
 - Analiza obrazów stereoskopowych
 - Akwizycja pasywna
 - Akwizycja wspomagana (projekcja wzorca-tekstury na skanowaną powierzchnie)
 - Wynik akwizycji otrzymujemy jako zbiór punktów w przestrzeni 3D, ew. wraz ze zbiorem krawędzi, tworzącym siatkę (ang. mesh)

- Przetwarzanie danych:
 - Uzupełnianie brakujących punktów
 - Wygładzanie (redukcja szumu)
 - Ekstrakcja cech lokalnych
 - Obliczenie lokalnych deskryptorów kształtu pozwala na wykrycie cech twarzy przydatnych w rejestracji obrazów i porównywaniu ze wzorcem
 - Przykładowo, analiza krzywizny powierzchni twarzy i jej modelowanie (modele 2 lub 3 stopnia) pozwala na lokalizację maksimów (np. czubek nosa), minimów (kąciki oczu), czy punktów siodłowych
 - Inną metodę stanowi analiza normalnych n(x,y) do płaszczyzny f(x,y), stycznej do powierzchni twarzy w danym punkcie:

$$f(x,y) = z = ax + by + c$$

$$n(x,y) = \frac{[-a, -b, 1]}{\sqrt{(1 + a^2 + b^2)}}$$

- Metody reprezentacji i rozpoznawania:
 - Oparte na całościowej kompletnej reprezentacji 3D twarzy
 - Możliwość (przybliżonej) rekonstrukcji twarzy na podstawie reprezentacji
 - Oparte na reprezentacjach niekompletnych
 - Większa odporność na zniekształcenia, okluzje, etc.

- Do grupy metod całościowych (rekonstrukcja przybliżona) należą metody oparte na PCA/LDA
 - Podejście analogiczne jak w przypadku obrazów 2D (zamiast odcienia szarości – głębokość/współrzędna z)
 - Konieczność normalizacji/rejestracji obrazu (tak samo jak w przypadku 2D)
 - Wrażliwość na zmiany wyrazu twarzy (tak samo jak w przypadku 2D)
 - Niewrażliwość na zmiany oświetlenia (w większości przypadków)
 - Składowa głębokości (z) ma bardziej niskoczęstotliwościowy charakter w por. do intensywności => możliwość użycia mniejszej liczby głównych składowych (principal components)

- Metoda Iterative Closest Point (ICP)
 - Zakłada się, że kształt twarzy po akwizycji (zwykle zbiór punktów w przestrzeni 3D) jest "podzbiorem" kształtu modelowego (wzorca)
 - Poszukuje się odpowiedniego przekształcenia "sztywnego" (obroty, translacje) dopasowującego kształt twarzy do wzorca
 - Etapem wstępnym dopasowania jest dopasowanie środków ciężkości reprezentacji twarzy i wzorca
 - Następnie wykonuje się iteracyjnie kroki:
 - Dopasowanie poszczególnych punktów metodą najbliższego sąsiada
 - Obliczenie współczynników optymalnego przekształcenia dla dopasowania z p. 1
 - W celu redukcji ryzyka utknięcia w minimum lokalnym algorytm ICP wykonuje się zwykle wielokrotnie

- Modele deformacji (deformation models)
 - Podstawę analizy stanowi neutralny wyraz twarzy ("neutral mesh")
 - Określa się lokalizację punktów kontrolnych, zależnych od wyrazu twarzy
 - Punkty kontrolne są dopasowywane pomiędzy porównywanymi obrazami i wykorzystywane do deformacji "neutralnej" siatki twarzy wzorcowych
- Niezależnie od metody rozpoznawania twarzy, w celu redukcji obliczeń można zastosować indeksowanie (wstępną selekcję – odrzucanie mało prawdopodobnych modeli)
 - Sferyczna reprezentacja twarzy i porównanie histogramów ilości punktów w funkcji odległości od ustalonego punktu twarzy (np. czubka nosa)

Rozpoznawanie twarzy – analiza wielospektralna

- Jednym z podstawowych problemów rozpoznawania twarzy jest wrażliwość na warunki oświetleniowe
 - Model generacji obrazu:

$$f(x,y) = i(x,y) \cdot r(x,y)$$

gdzie:

 $r \in (0,1)$ – współczynnik odbicia (ang. reflectance) $i \in (0,\infty)$ – oświetlenie (ang. illumination)

 Aby zminimalizować wpływ czynnika i można wykorzystać metody analizy wielospektralnej (ang. multispectral analysis), tj. obrazowanie w różnych zakresach długości fal elektromagnetycznych

Rozpoznawanie twarzy – analiza wielospektralna

Przykład twarzy w różnych zakresach promieniowania EM



- (a) pasmo widzialne: $0.4-0.7\mu m$
- (b) bliska podczerwień (near infrared, NIR / shortwave infrared, SWIR): 0.9–1.7 μm
- (c) średnia podczerwień (*midwave infrared*, MWIR): $3.0-5.0~\mu m$
- (d) (longwave infrared, LWIR): 8.0-14.0 μ m

Rozpoznawanie twarzy – analiza wielospektralna

- Obrazowanie w dalekiej podczerwieni
 - Analiza promieniowania generowanego (nie odbitego) przez obiekt
 - Niezależność od oświetlenia
 - Poprawne działanie również w całkowitej ciemności
 - Zależność od temperatury otoczenia, warunków atmosferycznych, wiatru, etc.
 - Zależność od chwilowej intensywności procesów metabolicznych (wysiłek fizyczny, infekcje)
 - Okluzje spowodowane przez okulary

Jednoczesne wykorzystanie metod obrazowania w różnych zakresach długości fali pozwala na połączenie ich zalet i poprawę wyników w stosunku do pojedynczego zakresu (np. widzialnego)

Dziękuję za uwagę